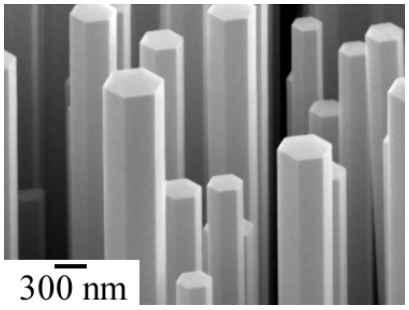
GEMaC

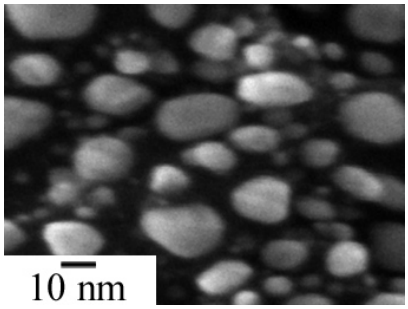
Groupe d'Étude de la Matière Condensée

FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

Modèle : JEOL 7001F



Nanofils de ZnO



Billes d'or nanométriques

Détecteurs :

- électrons secondaires : Everhart et Thornley
- électrons rétrodiffusés : rétractable
- cathodoluminescence : miroir parabolique rétractable

Spécifications :

- source d’électrons à émission de champ : pointe Schottky
- résolution ultime en électrons secondaires : 1,2 nm@ 30 kV et 3 nm@1 kV
- résolution en conditions d'analyse : 3 nm@ 15 kV / 5 nA / WD 10 mm
- tension d'accéleration : 500 V à 30 kV
- courant de faisceau : 1 pA à 200 nA
- gamme de grandissement : × 10 à × 1 000 000